

Disciplina Tópicos especiais: Microscopia de força atômica - CH 2

Ementa: Introdução. Microscopia de Força Atômica (AFM): teoria, instrumentação e aplicações das Modalidades: contato, não contato e “phase mode”. Cantilever. Scanner. SPM como uma ferramenta de análise de superfície. Processamento de imagens.

Bibliografia:

WIESENDANGER, R. Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy. Cambridge University Press, New York 1994.

COHEN, S.H.; BRAY, M.T.; LIGHTBODY, M.L. Atomic Force Microscopy/Scanning Tunneling Microscopy. Plenum Press, New York 1994.

CHEN, C.J. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. Oxford University Press, New York 1993